

蛍光X線でどんな試料も 非破壊で膜厚測定

標準試料が無くても正確度の高い膜厚測定が可能

XL5 Plus



XL5 Plus の3つの特徴

蛍光 X 線を用い
数秒で膜厚測定

磁性の有無に
よらず
測定可能

様々な形状にも
対応可能

独自アルゴリズムで幅広い試料の膜厚測定に対応

世界シェア No.1 の Niton シリーズ

- 非破壊で迅速に測定
- 合金基材や有機物基材にも対応
- 試料の切り出しや持ち運び不要、その場で測定
- 磁性の有無によらず測定が可能
- 様々な形状にも対応
- 蛍光X線で高精度測定

・シャフト (SUS上のCr/Ni膜)
の膜厚測定



・FPC基板上にプリントされたAg/Cuの膜厚測定
・水素燃料電池用Ti基板上的Pd/Ruコーティング



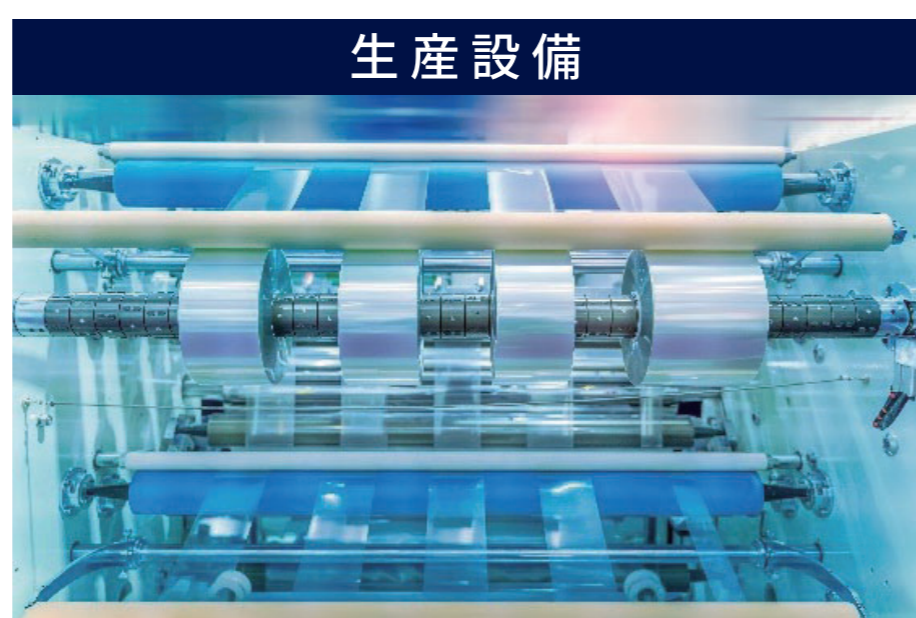
・自動車部品 (マフラー、鋼板、バンパー、内装品等)
の膜厚測定



・触媒の付着量管理や貴金属分析



・生産設備の部材に施された表面処理の膜厚管理



・フィルム上のSi付着量測定



Layer	μm	±2σ
4: Cr	2.35	0.01
3: Ni	11.06	0.08
2: Cu	1.49	0.03
1: Zn	6.12	0.16
Fe	Substrate	



多層膜測定

Layer	μm	±2σ
3: Cr	0.15	0.00
2: Ni	17.57	0.11
1: Cu	17.01	0.35
Plastic	Substrate	



樹脂上の装飾メッキ

選択可能な単位例
【厚みの単位】μm, mm
【重量の単位】g/m², mg/m², g/cm², mg/cm²